05

Рентгеновские лазеры в потоках кластеров и в наноструктурированных мишенях

© Е.П. Иванова

Институт спектроскопии РАН, 108840 Троицк, Москва, Россия e-mail: eivanova@isan.troitsk.ru

Поступила в редакцию 25.02.2019 г. В окончательной редакции 25.02.2019 г. Принята к публикации 15.03.2019 г.

Дан краткий обзор недавних работ, посвященных моделированию рентгеновских лазеров в потоках кластеров и в наноструктурированных мишенях. Расчеты атомных характеристик основаны на релятивистской теории возмущений с модельным потенциалом нулевого приближения. Обсуждены два новых результата. 1. Показано, что субпикосекундный рентгеновский лазер с $\lambda = 41.8$ nm, образованный в потоке кластеров ксенона, может служить альтернативой лазеру на свободных электронах. 2. В тяжелых Ni-подобных ионах ($Z \ge 60$) процессы ионизации иона и рекомбинации электронов на ион сбалансированы при электронных температурах ≥ 1500 eV, таким образом, состояние Ni-подобного иона квазистационарно. Квази-стационарными также являются инверсии уровней рентгеновского лазера для многих переходов. Обсуждена возможность экспериментального наблюдения рентгеновских лазеров на внутри-оболочечных переходах Gd³⁶⁺: $3p^54d^{10}4p$ [J = 0]– $3p^63d^94p$ [J = 0] с длинами волн в области водяного окна.

Ключевые слова: Ni-подобные ионы, рентгеновские лазеры.

DOI: 10.21883/OS.2019.07.47933.121-19

Введение

Рентгеновские лазеры (РЛ) являются основой для разработок ряда прорывных технологий. Наиболее важные из них: инициация реакции термоядерного синтеза в тяжелом водороде, создание источников излучения для нанолитографии нового поколения, разработка оптических приборов военного предназначения, исследование биологических нанообъектов, использование в генной инженерии, медицине и пр. Первые РЛ наблюдались в плазме, образованной в результате взаимодействия лазера накачки с твердотельными мишенями на переходах Ne-подобных [1,2] и Ni-подобных ионов [3-5]. В последующих работах велись исследования по увеличению коэффициента конвертируемости (КК) энергии накачки в энергию выходящего излучения РЛ. Кроме того, разрабатывались методы повышения пространственной и временной когерентности луча РЛ.

В последнее десятилетие исследуется взаимодействие потоков кластеров с интенсивным лазерным излучением инфракрасного диапазона с целью создания горячей плотной плазмы, которая служит источником излучения в области дальнего ультрафиолета. Механизм образования такой кластерной плазмы — ионизация оптическим полем (ИОП) кластеров в потоке. Одно из направлений таких исследований — создание РЛ с $\lambda = 1-40$ nm. К настоящему времени в потоке кластеров криптона уже создан компактный недорогой РЛ с $\lambda = 32.8$ nm с квантовым выходом 10^{12} photon/impulse, пригодный для многих типов исследований [6]. Коэффициент конверсии в [6] составляет 5 · 10^{-6} .

РЛ в потоке кластеров является этапом на пути создания РЛ в твердых наноструктурированных мишенях при условии достаточной интенсивности лазера накачки. Очевидным преимуществом плазмы, образованной в потоке кластеров, является относительная простота изменения параметров плазмы посредством варьирования давления газа в резервуаре, соединенном с соплом. Экспериментальные исследования РЛ в потоках кластеров [6-8] продемонстрировали фундаментальные преимущества использования наноструктурированных/кластерных мишеней для создания высокотемпературной плотной лазерной плазмы. Основные из них перечислим: і) малое отражение луча накачки от кластеров; іі) возможно поглощение более чем 90% энергии накачки; ііі) возможно достижение чрезвычайно высокой ($\sim 10 \, \text{keV}$) температуры электронов; iv) отсутствие осколков в плазме; v) энерговклад, а также ионная и электронная температуры в плазме контролируются размером кластеров, а также контрастностью импульса накачки; vi) плотность плазмы контролируется плотностью кластеров и их размером; vii) плазма характеризуется высокой чистотой и отсутствием оксидов. viii) Для реализации механизма ИОП необходима высокая интенсивность импульса накачки, т. е. его продольное распространение.

С использованием гауссовой формы импульса лазерной накачки возникает радиальная неоднородности плазмы по мере прохождения луча накачки через мишень, которая приводит к различному коэффициенту преломления распространяющегося луча в различных точках плазмы. Таким образом, чем длиннее плазменный шнур, тем больше неоднородность вдоль радиуса и соответственно тем больше расходимость выходящего РЛ. Расходимость выходящего излучения РЛ приводит к нарушению когерентности. Несомненным преимуществом твердых наноструктурированных мишеней является возможность достижения высокой степени когерентности выходящего луча РЛ за счет использования конусообразной формы мишени. Для каждой ситуации угол вершины конуса подбирается экспериментально с целью полностью компенсировать расходимость выходящего луча РЛ. В экспериментах [6–8] использовались многоимпульсные схемы накачки, поэтому коэффициент конверсии энергии накачки в энергию РЛ не превышал 10^{-5} .

Высокоэффективные РЛ возможны в потоках кластеров и в наноструктурированных мишенях с использованием одного импульса накачки. В потоках кластеров повторяемость импульсов может достигать более 10⁵. Проблема является многопараметрической; создание РЛ с одноимпульсной накачкой предполагает предварительную детальную разработку теоретической модели, в которой рассчитываются оптимальные параметры плазмы для достижения максимального энергетического выхода излучения РЛ. В радиационно-столкновительной модели РЛ коэффициенты усиления рассчитываются по известной формуле

$$g = A_{\rm ul}\lambda^2 [N_{\rm up} - (g_{\rm up}/g_{\rm low})N_{\rm low}]/8\pi\Delta\nu_0, \qquad (1)$$

где Aul — вероятность радиационного перехода с верхнего (up) на нижний (low) рабочий уровень; λ – длина волны перехода РЛ; $N_{\rm up} = n_i P_{\rm up}$ и $N_{\rm low} = n_i P_{\rm low}$ концентрации рабочих ионов, находящихся в верхнем и нижнем состояниях, т.е. плотность рабочих ионов, $P_{\rm up}$, *P*_{low} — населенности уровней; *g*_{up}, *g*_{low} — статистические веса верхнего и нижнего уровней. Профиль линии РЛ определяется сверткой допплеровского профиля и профиля, обусловленного радиационными и столкновительными переходами. Ширина в центре линии Δν₀. Профиль Фойгхта определяется упрощенным методом, предложенным в [9]. Населенности уровней рабочего иона определяются решением кинетических уравнений с заданными скоростными коэффициентами — вероятностями радиационных переходов и переходов, обусловленных электрон-ионными столкновениями. В кинетических уравнениях учтены уровни ионов соседних стадий ионизации (Си-подобной и Со-подобной). Учитываются все элементарные процессы, связывающие уровни рабочего иона с энергетическими уровнями соседних ионов [10]. Учет этих процессов в кинетических уравнениях позволяет рассчитать эволюцию ионизации рабочего иона в состояния иона с более высокой степенью ионизации. Значения населенностей верхнего и нижнего рабочих уровней являются величинами одного порядка; в результате вычитания в уравнении (1) первые значащие цифры сокращаются. Очевидно, что для достижения хорошей точности значений g(t) необходимы высокоточные значения скоростных коэффициентов в кинетических уравнениях. В нашей модели расчет уровней энергий и скоростных коэффициентов выполняется методом релятивистской теории возмущений с модельным потенциалом нулевого приближения (РТВМП) [11,12]. С использованием нашей модели Ne-подобная схема РЛ исследовалась в [13–15], Ni-подобная — в [16–22], Pdподобная — в [23–27].

В настоящей работе представлен обзор и добавлены новые результаты касательно недавно разработанных моделей РЛ, использующих один импульс накачки.

Ультракороткий рентгеновский лазер с длиной волны 41.8 nm в плазме, образованной при взаимодействии фемтосекундного лазера накачки с потоком кластеров ксенона, альтернатива лазеру на свободных электронах

Рентгеновские лазеры на свободных электронах (РЛСЭ) с длиной волны 1-10 nm и продолжительностью ~ 15 fs позволяют создавать голографические изображения нанообъектов за времена, сопоставимые с временами внутриатомных движений [28]. В 2017 г. в Гамбурге начал работать уникальный РЛСЭ, имеющий 6 станций для изучения быстропротекающих процессов в физике, химии, материаловедении, для исследования структур биологических макромолекул и пр.

Для многих применений возможно использование компактных РЛ с достаточно малыми длинами волн и с длительностью импульса менее 1 ps. Контрастное изображение нанообъекта достигается при условии, что в одном импульсе РЛ количество фотонов составляет более 10¹² при достаточно высокой степени когерентности луча РЛ. Преимущества использования в качестве мишеней потоков кластеров для создания высокоэффективных РЛ перечислены во введении (пункты i-vii). Эти разработки, а также большое значение сечения возбуждения электронным ударом верхнего рабочего уровня в Xe⁸⁺ (состояние Pd-подобного ксенона) являются предпосылками для достижения высоких значений коэффициентов усиления в плазме при оптимальных значениях электронной плотности n_e, температуры T_e, а также при правильно заданной геометрии плазменного шнура. Важнейшей предпосылкой для создания субпикосекундного РЛ является сильное возрастание сечения возбуждения электронным ударом верхнего рабочего уровня в Xe⁸⁺ при увеличении T_e. В оптимальных условиях ионизация Хе8+ происходит за время « 1 ps, что обеспечивает возможность создания эффективного РЛ с ультракоротким временем излучения t_{las}. Ниже приводится модельный расчет коэффициентов усиления g(t) и энергетических выходов на переходе

ксеноне (Xe⁸⁺) на переходе $4d_{5/2}5d_{5/2}[J=0]-4d_{5/2}5p_{3/2}[J=1]$. Расчет выполнен при $T_e = 300 \text{ eV}$, 4 — состояние вакансии в остове $4d^{10}$, 5 — состояние электрона над остовом. $d = 25 \,\mu\text{m}$ для значений атомарной плотности 5, 10, 15, 20 и 25 Тогг. Для сопоставления см. рис. 4 из [29].

4d5d [J = 0] - 4d5p [J = 1] с $\lambda = 41.8$ nm в Рd-подобном ксеноне в плазме, образованной при взаимодействии фемтосекундного лазера накачки с потоком кластеров ксенона. Проводится сопоставление с экспериментально измеренной эволюцией g(t), выполненной в [31] для разных значений плотности плазмы. Обсуждаются условия создания ультракороткого рентгеновского лазера с выходом > 10^{12} photon/s.

В нижеприведенных расчетах мы полагаем, что плазма — однородный цилиндр с диаметром $d = 25 \,\mu m$; T_e и T_i постоянны в течение усиления. Полагаем, что интенсивность фемтосекундного лазера накачки $\geq 10^{16}$ W/cm². В этом случае фракция Рd-подобного ксенона [Xe⁸⁺] после ионизации оптическим полем составляет 0.9 от полного числа ионов (см. расчеты [30] и эксперимент [31]). При использовании потока кластеров в качестве мишени нагрев плазмы происходит в результате взрыва ионизованного кластера; в начальный момент после взрыва $T_i \gg T_e$, однако термолизация (выравнивание) электрон-ионных температур при высокой плотности плазмы $(n_i \ge 10^{19} \, {
m cm}^{-3})$ происходит на временном интервале ~ 100 fs. Поэтому в настоящем расчете мы используем $T_e = T_i$. Это условие существенно отражается на допплеровской ширине линий переходов, тем не менее при высоких плотностях ($n_i \ge 10^{19} \, {\rm cm}^{-3}$) уширение линий, обусловленное электрон-ионным столкновением, превышает допплеровское.

Рисунок 1 представлен для сопоставления нашего расчета g(t) с экспериментом [29], где плазма создавалась методом ИОП атомарного ксенона в кювете. На рис. 1 показаны зависимости от времени коэффициентов усиления g(t) линии 41.8 nm в Xe⁸⁺. Расчет, как и эксперимент, выполнены для $T_e = 300 \,\text{eV}$ и различных

значений плотности атомарного газа ксенона: 5, 10, 15, 20, 25 Torr, что соответствует атомной плотности $n_i = (1.75.3.5, 5.25, 7.0, 8.75) \cdot 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3}$. Здесь для плазмы атомарного газа ксенона используем $T_i = T_e/4$. В нашем расчете диаметр плазмы $d = 25 \,\mu$ m; вариация диаметра в пределах 20-50 µm не влияет существенно на результат. Сопоставление рис. 1 настоящей работы с рис. 4 из [29] демонстрирует очень близкое совпадение продолжительности импульсов, максимальных значений величин g(t), формы кривых и зависимостей от плотности плазмы. Заметим, что предварительные расчеты кривых g(t) были представлены нами в ранней работе [23], которая была выполнена до эксперимента [29]. Продолжительность импульса РЛ t_{las} уменьшается с увеличением плотности плазмы по закону немного более медленному, чем 1/n_i, для указанного диапазона плотности.

На рис. 2 показаны результаты аналогичного расчета величин g(t) в предположении, что плазма образована в результате ИОП потока кластеров ксенона. Здесь $T_i = T_e$. Изменения поведения графиков на рис. 2 по сравнению с рис. 1 обусловлены двумя факторами: 1) увеличение ширины линии за счет увеличения допплеровского эффекта; 2) увеличение инверсии и коэффициента усиления за счет увеличения T_e при увеличении n_i. При малых плотностях $(n_i \le 10^{18} \text{ cm}^{-3})$ и $T_e \le 1000 \text{ eV}$ превалирует эффект уширения линии, поэтому g(t) ниже, чем соответствующие кривые на рис. 1. При больших плотностях $(n_i \ge 5 \cdot 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-3}, T_e \ge 5000 \,\mathrm{eV})$ превалирует эффект высокой скорости заселения верхнего рабочего уровня. Результаты, приведенные на рис. 2, рассчитаны для плазмы с атомарной плотностью в диапа-



Рис. 2. Временные характеристики коэффициентов усиления при плотности ионов $n_i = (6.25 - 43.75) \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ и $T_e = 4 - 8 \text{ keV}.$





Рис. 3. Зависимость от длины плазмы квантового выхода фотонов РЛ с $\lambda = 41.8$ nm.

зоне $(6.25-43.75) \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $T_e = 4-8 \text{ keV}$. Как видно из рисунка, при $n_i \ge 3 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ время достижения максимума $g(t) \sim 100 \text{ fs}$, а затухания $t_{\text{las}} \sim 1 \text{ ps}$, длина мишени L может быть $\sim 300 \,\mu\text{m}$. Выбор длины обусловлен энергией и условиями накачки, а также желаемым t_{las} .

Квантовые выходы фотонов с $\lambda = 41.8 \text{ nm}$ ($N_{\text{out}}^{\text{ph}}$) в зависимости от длины мишени представлены на рис. З для оптимальных параметров плазмы. Величина $N_{\text{out}}^{\text{ph}} \approx 2 \cdot 10^{12}$ photon/s на длине плазменного шнура 120 μ m, что соответствует продолжительности РЛ импульса $\sim t_{\text{las}} \sim 300$ fs. Параметры плазмы, соответствующие максимальному выходу при $t_{\text{las}} \approx 1$ ps: $L = 300 \,\mu$ m, $n_i = 2.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, $T_e = 8 \text{ keV}$; $N_{\text{out}}^{\text{ph}} \approx 1.7 \cdot 10^{13}$ /impulse. Насыщение РЛ по величине L происходит при $L \sim 300 \,\mu$ m, что соответствует $t_{\text{las}} \sim 1$ ps.

Оптимальные условия для субпикосекундного лазера (при использовании метода ИОП кластеров ксенона) находятся в довольно узком диапазоне атомных плотностей: $(2.25-2.35) \cdot 10^{19}$ сm⁻³. Очевидно, что для отсечения послесвечения при заданном $t_{\rm las}$ после начала выхода импульса РЛ с $\lambda = 41.8$ nm необходимо разработать систему оптического затвора на выходе из плазмы.

Длина волны перехода РЛ в Xe^{8+} ($\lambda_{las} = 41.8 \text{ nm}$) может с высокой точностью совпадать с 19-й гармоникой фемтосекундного лазера накачки, генерируемой в кювете с нейтральным ксеноном. Излучение высокой гармоники является пространственно когерентным. В эксперименте [29] разработана мультитерраваттная система накачки: Ті — сапфировый лазер (34 fs) с длиной волны 815 nm, в которой распространение луча РЛ в мишени и 19-й гармоники совпадают по времени. С помощью такой суперпозиции лучей было достигнута высокая степень когерентности выходящего луча РЛ.

В табл. 1 выполнено сопоставление технических характеристик РЛ на свободных электронах нового по-

коления и предлагаемого выше РЛ в потоке кластеров ксенона.

Классификация переходов рентгеновских лазеров в Ni-подобных ионах

На рис. 4 показана новая схема возможных переходов РЛ в ионах Ni-подобной последовательности. Лазерные переходы показаны наклонными штриховыми стрелками; радиационные распады нижнего рабочего уровня показаны вертикальными штрихпунктирными стрелками; быстрое заселение верхних рабочих уровней из основного состояния за счет электрон-ионных столкновений показано сплошными вертикальными стрелками. Для упрощения на рис. 4 показан лишь один стандартный переход 3d4d [J = 0] - 3d4p [J = 1], здесь используем обозначения: 3 — состояние вакансии, 4 — состояние электрона. Обзор экспериментов для обоих стандартных переходов можно найти в [32].

В стандартных переходах РЛ инверсия рабочих уровней возникает благодаря сильному монопольному возбуждению электронным ударом верхнего рабочего уровня 3d4d [J = 0] и быстрому радиационному распаду нижнего рабочего уровня 3d4p [J = 1]. Уточненные длины волн двух стандартных переходов РЛ в Ni-подобных ионах приведены в [33], где показано, что точность расчета [33] находится в пределах ошибок экспериментальных измерений длин волн.

Менее изученным является переход РЛ, инверсия которого обусловлена сильным перепоглощением (реабсорбцией) фотона, излучаемого с самого сильного резонансного уровня $3d_{3/2}4f_{5/2}[J=1]$. Благодаря эффекту реабсорбции радиационное опустошение резонансного уровня в плазме на ~ 2 порядка меньше, чем в изолированном ионе. Рисунок 4 показывает быстрое возбуждение электронным ударом этого уровня из основного состояния $3d^{10}$. Реабсорбция резонансного фотона приводит к увеличению населенности уровня и к инверсии относительно уровня $3d_{3/2}4d_{3/2}[J=1]$. РЛ на переходе $3d_{3/2}4f_{5/2}[J=1]-3d_{3/2}4d_{3/2}[J=1]$ предсказывался в теоретической работе [34] и изучался экспериментально в [35,36]. Особенностью этого перехода РЛ является чрезвычайно короткая продолжительность лазерного эффекта, что затрудняет его наблюдение. Длины волн РЛ с оптической самонакачкой в Ni-подобных ионах с $Z \le 79$ рассчитаны в нашей работе [37], где установлено, что в ${
m Sn}^{22+}\,(Z=50),\,\lambda_{
m las}\sim 134$ Å. Для этой области излучения многослойные зеркала Mo/Si были разработаны еще в 1993 г. [38]. В Xe²⁶⁺ (Z=54) $\lambda_{\rm las}\sim 11.3$ nm; для этой области серия измерений коэффициентов отражения от многослойного зеркала Мо/Ве при нормальном падении выполнена в [39]. В Yb⁴²⁺ (Z = 70), $\lambda_{\text{las}} \sim 67.25$ Å. Многослойные зеркала на основе La/B для длин волн 67.1-68.9 Å разработаны в [40].



Рис. 4. Классификация переходов РЛ в Ni-подобных ионах.

В [22] выполнен модельный расчет РЛ с оптической самонакачкой с $\lambda \sim 13.4$ nm на переходе $3d_{3/2}^94f_{5/2}$ [J = 1] $-3d_{3/2}^94d_{3/2}$ [J = 1] в Sn²²⁺. Предполагалось, что плазма формируется при взаимодействии наноструктурированной мишени олова ($d = 40 \, \mu$ m, $L_{\text{max}} = 0.5$ cm) с интенсивным источником накачки: $I_{\text{pump}} \sim 8 \cdot 10^{17}$ W/cm², $E_{\text{pump}} \leq 1$ J, продолжительностью $t_{\text{pump}} \sim 120$ fs. Продолжительность эффекта РЛ $t_{\text{las}} \sim 15$ ps. При оптимальных параметрах плазмы — $n_i = 1.4 \cdot 10^{19}$ cm⁻³, $n_e \sim 3 \cdot 10^{20}$ cm⁻³, $T_e \approx 2000$ eV — энергетический выход РЛ может составлять до 0.3% от E_{pump} .

На рис. 4 вверху показаны переходы РЛ между высоковозбужденными уровнями Ni-подобных ионов. Это уровни конфигураций, соответствующих возбуждению электрона из оболочки $3p^6$. Эти состояния не изучались экспериментально, также нет экспериментальных результатов по наблюдению РЛ на этих переходах. Однако аналогичная схема РЛ на переходах Ne-подобного германия была продемонстрирована в [41]. В нашей работе [21] детально исследовались РЛ в потоке кластеров ксенона; рассматривались переходы, длины волн которых соответствуют высоким коэффициентам отражения от многослойных зеркал. Эти переходы, их длины волн и вероятности радиационных переходов между верхними и нижними рабочими уровнями РЛ представлены в табл. 2. В [21] впервые исследованы новые механизмы образования инверсии на переходах 81-69, 89-76. Оптимальные

Характеристики	Рентгеновский лазер в потоке кластеров ксенона	Рентгеновский лазер нового поколения в Гамбурге	
Размер	Table-top (небольшое помещение)	Длина 3.5 km	
Длина волны $\lambda_{ m las}$	41.8 nm	0.05–6 nm	
Частота повторения импульса РЛ	$10^5 {\rm s}^{-1} \qquad \qquad 2.7 \cdot 10^4 {\rm s}^{-1}$		
Стоимость	От одного миллиона евро, обслуживание \sim несколько человек	1.5 миллиардов евро + дорогостоящее обслуживание	
Распространенность	Возможно создание множества установок	Уникальная установка в Европе	
Наименьшая продолжительность импульса РЛ (t _{las})	\leq 300 fs	$\sim 100{ m fs}$	

Таблица 1. Сопоставление характеристик РЛ в потоке кластеров ксенона и РЛ на свободных электронах

Порядковый номер уровня	Верхний уровень Ј	Нижний уровень Ј	λ, nm	Вероятность радиационного перехода	
Стандартный переход					
35-12	$3d_{3/2}4d_{3/2}$ 0	$3d_{5/2}4p_{3/2}$ 1	9.9	$1.0 \cdot 10^{11}$	
Переходы между высоковозбужденными уровнями					
80-68	$3p_{1/2}4d_{5/2}$ 2	$3p_{1/2}4p_{3/2}$ 1	13.86	$1.1 \cdot 10^{11}$	
81-69	$3p_{1/2}4d_{5/2}$ 3	$3p_{1/2}4p_{3/2}$ 2	13.89	$1.2 \cdot 10^{11}$	
89-76	$3p_{3/2}4f_{7/2}$ 2	$3p_{3/2}4d_{5/2}$ 1	13.35	$1.1 \cdot 10^{13}$	
93-79	$3p_{1/2}4f_{5/2}$ 2	$3p_{1/2}4d_{3/2}$ 1	13.0	$1.1 \cdot 10^{11}$	
Переход с оптической самонакачкой					
57-28	$3d_{3/2}4f_{5/2}$ 1	$3d_{3/2}4d_{3/2}$ 1	11.3	$4.4\cdot10^{10}$	

Таблица 2. РЛ переходы в Xe²⁶⁺ в области 9.9, 13.5 и 11.3 nm

параметры плазмы и энергетические выходы рассчитаны для каждой линии РЛ.

Ошибка расчета длин волн переходов между уровнями нижних конфигураций $3d^94l$ составляет $\sim \pm 0.1$ nm; для переходов между высоковозбужденными конфигурациями $3p^53d^{10}4l$, где велико влияние неучтенных корреляционных эффектов, ошибка может быть несколько больше. Для переходов между высоковозбужденными состояниями указано четыре сильных РЛ-перехода, которые могут перекрываться, образуя профиль шириной $\sim 0.2-0.3$ nm с центром в области 13.4-13.5 nm. Такие профили наблюдались экспериментально в потоках кластеров ксенона при изучении спектров ионов Xe²⁶⁺ [42–44]. Несмотря на чрезвычайно высокий коэффициент конверсии для линий в области 13.4-13.5 nm (до 0.5%) и 11.3 nm (до 2%), в этих работах не сообщалось о наблюдении эффекта РЛ.

Рассчитанные здесь длины волн λ_{las} предлагаются для использования соответствующих РЛ в качестве источников для проекционной нанолитографии. Разработанные многослойные зеркала обладают высоким коэффициентом отражения в довольно узкой области спектра, обычная ширина составляет несколько ангстрем. В нашей работе [20] предлагается проект прецизионного измерения длины волны РЛ, образованного в результате взаимодействия наноструктурированной мишени с интенсивным ультракоротким импульсом накачки.

Рентгеновские лазеры в области водяного окна на внутриоболочечных переходах Ni-подобных ионов

На рис. 4 показана схема РЛ на внутриоболочечных переходах Ni-подобных ионов: 3p4p[J=0]-3d4p[J=1]. Здесь переход происходит из высоковозбужденно-го состояния вакансии 3p в состояние вакансии 3d, электрон 4p является "наблюдателем". Механизм инверсии внутри-оболочечных переходов аналогичен механизму инверсии стандартных переходов (рис. 4), однако их длины волн примерно в два раза короче длин волн стандартных переходов. Здесь выполнен модельный расчет коэффициентов усиления g(t) для двух наиболее сильных перехо-



Рис. 5. Модельный спектр излучения плазмы, показывающий линии Gd^{36+} с $\lambda \sim 2.62$ и 3.43 nm с учетом усиления РЛ. Расчет выполнен в условиях оптимальных параметров плазмы.

дов $3p_{1/2}4p_{1/2}[J=0]-3d_{3/2}4p_{1/2}[J=1]$ ($\lambda\sim 2.62\,\mathrm{nm}$) и $3p_{3/2}4p_{3/2}[J=0]-3d_{5/2}4p_{3/2}[J=1]$ ($\lambda \sim 3.43$ nm) в Niподобном гадолинии (Gd³⁶⁺). Оба перехода соответствуют области "водяного окна", которое находится между краями К-поглощения углерода (4.37 nm) и кислорода (2.33 nm). Излучение РЛ формируется в плазме, образованной при взаимодействии интенсивного лазера накачки с мишенью наноструктурированного гадолиния. В нашей работе [20] были найдены оптимальные условия для стандартного перехода 3d4d[J=0]-3d4p[J=1] в Gd^{36+} с $\lambda_{\mathrm{las}} = 6.748$ nm. В [20] было показано, что если T_e находится в пределах 1500-2000 eV, то процессы ионизации электронов из рабочего иона Gd³⁶⁺ и рекомбинации электронов на этот ион сбалансированы, в этом случае ионизационный баланс в плазме, населенности уровней и инверсии являются квазистационарными на временном интервале $\sim 100\,\mathrm{ps.}$ Это утверждение справедливо для стандартных внутриоболочечных и многих других переходов РЛ в Gd³⁶⁺.

В оптимальных условиях асимптотическое значение $g(t) = 5 \, \mathrm{cm}^{-1}$ для наиболее сильной линии внутриоболочечного перехода с $\lambda_{\text{las}} \approx 3.43$ nm. Таким образом, при $t_{\rm las} \ge 100\,{
m ps}$ насыщение по длине мишени и большой коэффициент конверсии могут быть достигнуты при $L \sim 3-3.5 \, {\rm cm}$. На рис. 5 показан модельный спектр Gd³⁶⁺, рассчитанный в оптимальных условиях для генерации линий РЛ в области водяного окна. Такой результат справедлив для достаточно тяжелых Ni-подобных ионов с Z > 60, где квазистационарное состояние плазмы имеет место при достаточно высоких T_e , при которых для многих переходов велики значения g(t). С уменьшением Z значение T_e, при котором процессы ионизации и рекомбинации на рабочий ион сбалансированы, уменьшается. Так, в ионе Xe²⁶⁺ квазистационарное состояние рабочего иона происходит при $T_e \approx 400 \text{ eV}$; это показано в нашем расчете [21] и в эксперименте [45]. При столь низком значении T_e величина g(t) для всех переходов слишком мала для регистрации РЛ.

В эксперименте [46] было показано, что высокоинтенсивные когерентные РЛ с λ_{las} в области водяного окна являются перспективными источниками для получения трехмерных голографических изображений быстро изменяющихся биологических наноструктур. Обзор многослойной оптики для мягкой рентгеновской области представлен в [47]. В последующих работах мы выполним детальное исследование коротковолновых РЛ на внутриоболочечных переходах Ni-подобных ионов.

Заключение

Создание ультракороткого импульса накачки в потоке кластеров ксенона на переходе Xe^{8+} обусловлено тремя факторами. i) Сильное возбуждение верхнего рабочего уровня $4d_{5/2}5d_{5/2}$ [J = 0] из основного состояния $4d^{10}$. ii) Быстрая ионизация Xe^{8+} в состояния с более высокой стадией ионизации Xe^{9+} , Xe^{10+} ... iii) Большой коэффициент усиления, усредненный на временном интервале t_{las} . Для получения плазмы, в которой фракция ионов Xe^{8+} составляет ~ 90%, интенсивность накачки должна быть ~ $3 \cdot 10^{16}$ W/cm². Для ионизации электронов из оболочки $4d^{10}$ методом ИОП потребуется на порядок более высокая интенсивность [29,30].

Экспериментальная установка для генерации ультракороткого импульса РЛ должна формировать три импульса излучения Ті-сапфировым лазером накачки с длиной волны 815 nm. Первый импульс предназначен для накачки плазменного шнура в потоке кластеров ксенона, второй должен проходить через линию задержки и использоваться для генерации 19-й гармоники в кювете с нейтральным ксеноном, а третий должен проходить через вторую линию задержки для создания ультрабыстрого затвора, поглощающего остаточное излучение через 0.3-1 ps после начала генерации РЛ. Вторая линия задержки обеспечивает импульс излучения для ультрабыстрой ионизации (взрыва) внешней части фольгифильтра, превращая ее в низкотемпературную плазму, поглощающую оставшуюся часть излучения из активной области плазмы. Ультрабыстрый затвор с точностью до 1 fs обеспечивает резкий обрыв импульса РЛ. В этой схеме возможно получение импульса РЛ с чрезвычайно крутыми передним и задним фронтами. Отсутствие пьедестала и послесвечения представляется перспективным для изучения сверхбыстрых процессов.

Для прецизионного измерение $\lambda_{\rm las}$ требуется интенсивность накачки, при которой после взаимодействия импульса накачки с мишенью формируется плазма, в которой фракция изучаемого Ni-подобного иона составляла бы ~ 80–90%. Для образования Xe²⁶⁺ в потоке кластеров ксенона $I_{\rm pump} = 10^{18}$ W/cm² [42–44]; для образования Gd³⁶⁺ в наноструктурированной мишени $I_{\rm pump} \sim 10^{19}$ W/cm2. Далее спектр регистрируется в режиме ионизации Ni-подобного иона, при этом временные оптические затворы обеспечивают регистрацию излучения из плазмы за время ионизации. Временные характеристики излучения линий РЛ из плазмы рассчитываются в нашей модели. Проблема упрощается для случая, когда необходимо только достижение значительного коэффициента конверсии (высокого энергетического выхода РЛ), при этом точность измерения лазерных линий может быть несколько ниже. В этом случае достаточно использовать $I_{\text{pump}} \sim 10^{14} - 10^{15} \text{ W/cm}^2$ при достаточно высоком значении E_{pump} , которое обеспечивает высокотемпературную плазму, в которой Ni-подобная стадия еще не достигнута после взаимодействия мишени с импульсом накачки. Далее происходит ионизация ионов до образования Ni-подобной стадии. Регистрацию излучения РЛ желательно производить с использованием оптических затворов.

Конфликт интересов

Автор заявляет, что у неё нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] *Matthews D.L. et al.* // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 54. N 2. P. 110.
- [2] Rosen M.D. et al. // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 54. N 2. P. 106.
- [3] McGowan B.J., Maxon S., Hagelstein P.L., Keane C.J., London R.A., Matthews D.L., Rosen M.D., Scofield J.H., Whelan D.L. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. N 19. P. 2157.
- [4] McGowan B.J. et al. // Phys. Fluids B. 1992. V. 4. N 7. P. 2326.
- [5] Daido H., Kato Y., Murai K., Ninomiya S., Kodama R., Yuan G., Oshikane Y., Takagi M., Takabe H. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 75. N 6. P. 1074.
- [6] Chen B.K. et al. // Appl. Phys. B. 2012. V. 106. N 4. P. 817.
- [7] Chou M.-C., Lin P.-H., Lin C.-A., Lin J.-Y., Wang J., Chen S.-Y. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. N 6. 063904.
- [8] Chu H-H., Tsai H-E., Chou M-C., Yang L-S., Lin J-Y., Lee C-H., Wang J., Chen S-Y. // Phys. Rev. A. 2005. V. 71. N 6. 061804.
- [9] Whitney K.J., Dasgupta A., Pulsifer P.E. // Phys. Rev. E. 1994.
 V. 50. N 1. P. 468.
- [10] Ivanov L.N., Ivanova E.G., Molchanov A.G., Knight L.V. // Physica Scripta. 1996. V. 53. P. 653.
- [11] Ivanov L.N., Ivanova E.P., Knight L.V. // Phys. Rev. A. 1993.
 V. 48. N 6. P. 4365.
- [12] Иванова Е.П. // Опт. и спектр. 2014. Т. 117. № 2. С. 179; Ivanova E.P. // Opt. Spectrosc. 2014. V. 117. N 2. Р. 179.
- [13] Иванова Е.П., Зиновьев Н.А. // Квант. электрон. 1999. Т. 27. № 3. С. 207. Ivanova E.P., Zinoviev N.A. // Quantum Electronics. 1999. V. 27. N 3. P. 207.
- [14] Ivanova E.P., Ivanov A.L., Zinoviev N.A., Knight L.V. // SPIE. 1999. V. 3735. P. 266.
- [15] Ivanova E.P., Zinoviev N.A. // Phys. Lett. A. 2000. V. 274. N 5–6. P. 239.
- [16] Ivanova E.P., Zinoviev A.N. // J. Phys. IV. France. 2001. V. 11. Pr 2–151.
- [17] Иванова Е.П., Зиновьев А.Н., Найт Л.В. // Квант. электрон. 2001. Т. 31. № 8. С. 683; Ivanova E.P., Zinoviev N.A., Knight L.V. // Quantum Electronics. 2001. V. 31. N 8. Р. 683.
- [18] Иванова Е.П., Иванов А.Л. // ЖЭТФ. 2005. Т. 127. № 5. С. 957; Ivanova E.P., Ivanov А.Л. // JETPh. 2005. V. 127. N 5. P. 957.
- [19] Иванова Е.П. Виноходов А.Ю. // Квант. электрон. Т. 43. № 12. С. 1099.

- [20] Ivanova E.P. // Laser Phys. Lett. 2015. V. 12. N 10. P. 105801.
- [21] Ivanova E.P. // Laser Phys. 2017. V. 27. N 5. P. 055802.
- [22] Ivanova E.P. // Laser Phys. Lett. 2018. V. 15. N 9. P. 0930267.
- [23] Иванова Е.П., Иванов А.Л. // Квант. электрон. 2004. Т. 34. № 11. С. 1013.
- [24] Иванова Е.П. // Квант электрон. 2008. Т. 38. № 10. С. 917.
- [25] Ivanova E.P. // Phys. Rev. A. 2010. V. 82. N 4. P. 042824.
- [26] Ivanova E.P. // Phys. Rev. A. 2011. V. 84. N 4. P. 043829.
- [27] Иванова Е.П. // Квант. электрон. 2012. Т. 42. № 12. С. 1100.
- [28] Brady D.J. et al. // Nature. 2012. V. 486. N 7403. P. 386.
- [29] Mocek T., Sebban S., Maynard G., Zeitoun Ph., Faivre G., Hallou A., FaJardo M., Kazamias S., Cros B., Aubert D., de Lachéze-Murel G., Rousseau J.P., Dubau J. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 95. N 17. P. 173902.
- [30] Lemoff B.E., Barty C.P.J., Harris S.E. // Opt. Lett. 1994. V. 19. N 8. P. 569.
- [31] Lemoff B.E., Yin G.Y., Gordon III C.L., Barty C.P.J., Harris S.E. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 74. N 9. P. 1574.
- [32] Daido H. // Pep. Prog. Phys. 2002. V. 65. N 10. P. 1513.
- [33] Иванова Е.П. // Опт. и спектр. 2015. Т. 118. № 4. С. 535; Ivanova E.P. // Opt. Spectrosc. 2015. V. 118. N 4. Р. 535.
- [34] Nilsen J. // J. Opt. Soc. Am. B 1997. V. 14. N 6. P. 1511.
- [35] Nilsen J., Dunn J., Osterheld A.L., Li Y. // Phys. Rev. A. 1999. V. 60. N 4. R2677.
- [36] Siegrist M., Jia F., Balmer J. // Proceedings of the Conference "X-ray Lasers 2014". Springer Proceedings in Physics. 2014. V. 169. P. 89–93.
- [37] Иванова Е.П. // Опт. и спектр. 2018. Т. 125. № 2. С. 147.
- [38] Stearns D.G., Rosen R.S., Vernon S.P. // Appl. Opt. 1993. V. 32. N 34. P. 6952.
- [39] Skulina K.S., Alford C.S., Bionta R.M., Makowiecki D.M., Gullikson E.M., Soufli R., Kortright J.B., Underwood J.H. // Appl. Opt. 1995. V. 34. N 19. P. 3727.
- [40] Makhotkin I.A., Zoethout E., Van de Kruijs R., Yakunin N., Louis E., Yakunin A.M., Banine V., Bijkerk F. // Optics Express. 2013. V. 21. N 24. P. 29894.
- [41] Enright G.D., Villeneuve D.M., Dunn J., Baldis H.A., Kieffer J.C., Pépin H., Chaker M., Herman P.R. // J. Opt. Soc. Amer. 1991. V. 8. N 10. P. 2047.
- [42] Ter-Avetisyan S., Schnürer M., Stiel H., Vogt U., Randolf W., Karpov W., Sandner W., Nickles P.V. // Phys. Rev. E. 2001. V. 64. N 3. P. 036404.
- [43] Mori M., Shiraishi T., Takahashi E., Suzuki H., Sharma L.B., Miura E., Kondo K. // J. Appl. Phys. 2001. V. 90. N 7. P. 3595.
- [44] Ter-Avetisyan S., Vogt U., Stiel H., Schnürer M., Will I., Nickles P.V. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. N 9. P. 5489.
- [45] Chenais-Popovich C., Malka V., Gathier J.-C. et al. // Phys. Rev. E. 2002. V. 65. N 4. P. 046418.
- [46] Trebes J.E. et al. // Science. 1987. V. 238. N 4826. P. 517.
- [47] Barysheva M.M., Pestov A.E., Salaschenko N.N., Toropov M.N., Chkhalo N.I. // Usp. Phys. Nauk. 2012. V. 182. N 7. P. 727.